



各 位

平成 17 年 12 月 22 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 有 限 公 司
代 表 者 の
役 職 名 代 表 取 締 役 社 長 坂 根 英 生
(コード番号 6855 東証 2 部)
問 い 合 わ せ 先 I R 室 室 長 原 靖 人
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 4 3 2

子会社ジェム台湾社と台湾のSTAr社とのプローブカードにかかる製造販売に関する契約締結のお知らせ

当社の子会社であるジェム台湾社と台湾の STAr 社とのプローブカードにかかる製造販売に関する契約を締結することになりましたのでお知らせします。

記

当社の 100%子会社のジェム台湾社は、台湾で半導体検査用部品プローブカードの製造・販売を行っております。一方、STAr 社は台湾に本社を置き、パラメトリックテストソリューション（検査装置、検査ソフト、パラメトリックプローブカード）の事業をアジア中心に展開しています。

1. 製造販売に関する契約締結について

台湾での半導体検査ビジネスのポテンシャルは今後とも大きく、同地域でのシェアアップは当社グループの重要な経営課題であります。

このようなことから、台湾市場での事業拡大が期待できること等から、今般、ビジネスパートナーとして実績があり、台湾市場においてプローブカードの強力な販売網をもつ STAr 社と次の製造販売に関する契約を締結いたしました。

ジェム台湾社は、CE・CP・VC・VH・VS・VRおよび STAr 社のパラメトリックプローブカードの独占製造を行う。

(注)

CE (カンチレバー型プローブカード)

CP (カンチレバー型プローブカード (微小電流用))

VC (垂直接触型プローブカード)

VH (高密度垂直接触型プローブカード)

VS (垂直スプリング接触型プローブカード)

VR (垂直スプリング接触型プローブカード (チップサイズパッケージ用))

STAr 社は、台湾市場において上記 の製品の独占製造を行う。

2. STAR 社とのこれまでの協業について

当社はウエハプロセスでのビジネスの展開の一つとしてパラメトリックテスト市場の開拓を予てより志向しており、この領域で優れた性能（^{*注} 業界初のウエハ温度最大-40～150 での性能保証、業界初の性能保証値への到達時間保証、業界初のリークレベル 300F A の保証）のパラメトリックテストプローブカードを持つ STAR 社と 2004 年 4 月に同プローブカードの包括契約を締結し、同製品を当社のプローブカードのラインアップに加え営業開始しております。これにより、当社のウエハテストソリューションビジネスのレベルアップを図っています。

3. ジェム台湾社の概要

社 名	JEM TAIWAN PROBE CORP. (1993 年 設立)
所 在 地	6F-2, No.35, Hsin Tai Road Chupei, Hsin Chu Hsien Taiwan, R.O.C.
事 業 内 容	半導体検査用部品の製造・販売
売 上 高	658 百万円 (2005 年 3 月期)

4. STAR 社の概要

社 名	STAR Technologies Inc. (2000 年 設立)
所 在 地	4F, No.669, Sec.4 Chung Hsing Road, ChuTung, HsinChu Taiwan, R.O.C.
事 業 内 容	半導体検査装置などの製造・販売
売 上 高	988 百万円 (2004 年 12 月期)

*注：パラメトリックテストはウエハテスト前に、ウエハでの微小電流漏れの有無などを測定しウエハテストの可否を判定する検査です。

以 上